

Codul disciplinei DIS404M

Numar credite 6

Specializarea

Microelectronica, optoelectronica si nanotehnologii

Obiective

Prezentarea modelelor de defecte logice utilizate in tehnologiile actuale. Prezentarea tehnicilor de simu

Descriptori Defecte logice, defecte fizice. Detectia si localizarea defectelor. Generarea t

Documente

[Fisa disciplinei](#) |

[Programa analitica](#)

Resurse Internet

Pagina cursului | [***Moodle***](#)

Titular

Conf.dr.ing. [Damian Imbrea](#) (curs, laborator)

{backbutton}